

異物分析・不良解析に役立つ走査型電子顕微鏡の活用法

プラスチックや金属の製品に異物が付着したり、不具合が発生したりした場合、異物が何であるかや不具合発生の原因を調査する際に、走査型電子顕微鏡による表面観察及び元素分析は非常に有効な手段となります。しかし、精度の高い観察・分析を実現するためには、適切な試料前処理、測定条件の設定、データ解析など、高度な技術が必要不可欠です。

本講習会では、走査型電子顕微鏡の基本原理の解説とともに、製品に混入した異物分析や不良解析に役立つ観察及び分析技術について、測定事例を交えて講演いただきます。

講 師 株式会社日立ハイテクフィールドイテック
コアテク/ロジサービス本部 解析装置部
ソリューションビジネス推進グループ 西村 雅子 氏

日 時 令和8(2026)年11月12日(木) 13時30分～16時

場 所 栃木県産業技術センター
県南技術支援センター 多目的ルーム
(栃木県佐野市天神町 950)
～Microsoft Teams によるオンライン同時配信～

定 員 会場参加20名
※会場参加申込数が定員を超過した場合、オンラインでのご参加をお願いすることがあります。

受 講 料 無料

申込締切 令和8(2026)年11月6日(金)

申込方法 別紙申込書により、ファックス又は電子メールでお申し込みください。
または、以下の申し込みフォームを御利用ください。
<https://tochigi-network.com/event/3140>
(とちぎ地域企業応援ネットワークポータルサイト)



申込み・お問い合わせ先

栃木県産業技術センター県南技術支援センター 化学・資源チーム
担当：金子、伊藤 TEL:0283-22-0733 FAX:0283-22-7689
E-mail: kennan-gc@pref.tochigi.lg.jp

